

名古屋大学未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設機器利用料

平成27年10月1日

(単位：円、消費税込み)

番号	機器等名称	学内者	学外者		備考
			非営利法人	営利法人	
1	反応科学超高压電子顕微鏡 (JEM-1000K RS) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	2,700	3,500	10,300	☆
		---	4,200	12,500	
2	収差補正電子顕微鏡 (EM-10000BU) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,200	1,500	5,000	☆
		---	1,800	6,100	
3	収差補正電子顕微鏡 (JEM-ARM200F) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,200	1,500	4,900	☆
		---	1,800	5,900	
4	ホログラフィー電子顕微鏡 (HF-2000) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	600	800	3,000	☆
		---	1,000	3,600	
5	電子分光電子顕微鏡 (JEM-2100M) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,000	1,300	5,200	☆
		---	1,600	6,300	
6	高分解能分析電子顕微鏡 (JEM-2010) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	600	800	5,000	☆
		---	1,000	6,100	
7	走査電子顕微鏡 (わ°ショ)研究成果非公開使用料	600	800	4,200	☆
		---	1,000	5,100	
8	集束イオン加工機 (FB-2100) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,300	1,700	4,000	☆
		---	2,100	4,800	
9	高速加工観察分析装置 (FIB-SEM) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,300	1,700	3,800	☆
		---	2,100	4,600	
10	アルゴンイオン照射試料作製装置 クロスセクションポリッシャー (わ°ショ)研究成果非公開使用料	300	300	800	☆
		---	400	1,000	
11	クライオミクロトーム (わ°ショ)研究成果非公開使用料	300	400	600	☆
		---	500	700	
12	金属イオン照射試料作製装置 (PIPS- II) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	200	200	600	☆
		---	200	700	
13	電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM2100F/H) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	900	1,100	5,000	
		---	1,300	6,100	
14	三次元観察電子顕微鏡 (TECNAI G2 Polara) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,300	1,700	9,300	
		---	2,100	11,300	
15	汎用電子顕微鏡 (H-800) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	600	800	2,400	
		---	1,000	2,900	
16	収差補正電子顕微鏡 (JEM-2100F) (わ°ショ)研究成果非公開使用料	1,600	2,100	6,900	
		---	2,500	8,300	

☆共用機器使用料は、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細構造解析)」の採択により軽減されております。事業終了後は、通常の料金設定となります。

- 基本使用料は電子顕微鏡利用時間1時間当たりの利用料です。
- 利用報告の非公開利用料は電子顕微鏡利用時間1時間当たりのオプション料金であり、基本料金に別途加算します。
- 利用料には、消費税が含まれています。

○解析手数料 (単位：円)

1時間当たり
6,500

○コンサルティング料 (単位：円)

3時間未満	3時間以上～6時間未満	6時間以上～8時間
65,000	162,500	260,000